

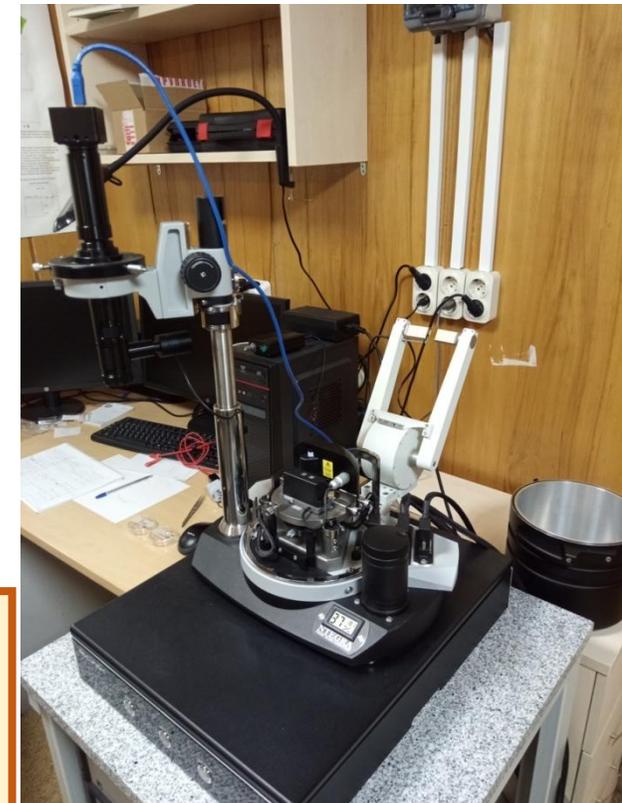
# Многофункциональный атомно-силовой микроскоп

Исследовательская платформа NTEGRA Prima разработана для исследований морфологии, а также механических и электрофизических свойств твердых и порошкообразных образцов с возможностью работы в жидкостной ячейке или в присутствии магнитного поля.

Параметр	Значение
максимальная область сканирования	100×100×10 мкм
разрешение по оси Z	не хуже 0,05 нм
разрешение по осям X и Y	не хуже 0,5 нм
величина магнитного поля в плоскости образца	1500 Гаусс
по нормали к образцу	400 Гаусс
максимальная температура ячейки	60° С
диапазон измеряемых токов	30 пА - 50 нА

## Основные методики измерений:

- контактная атомно-силовая микроскопия;
- полуконтактная атомно-силовая микроскопия;
- сканирующая туннельная микроскопия;
- метод зонда Кельвина;
- магнитно – силовая микроскопия;
- электростатическая микроскопия;
- силовая и токовая литография;
- **прыжковая атомно-силовая микроскопия.**



Помещение: ул. Косыгина 4, 1-ый корпус, комната 50

Контактное лицо: Гришин М.В., тел. (499) 137-61-30

<https://www.mteon.ru/katalog/atomno-silovye-mikroskopy/123-2/ntegra-prima/>